トル分析器で確認する。この場合は、発射された電波の周波数が試験周波数であることをスペクトル分析器のピークサーチ機能で確認する。

⑸　試験機器を受信状態とする。

⑹　試験機器の入力電圧が 45dBμＶ となるように標準信号発生器の出力を設定し、試験機器から電波が発射されないことをスペクトル分析器で確認する。

⑺　占有周波数帯幅が 288kHz を超えるものにあっては、試験周波数に隣接する周波数を含む３波を次の組み合わせとして、⑴から⑹までの試験を行う。

番号	試験周波数組み合わせ条件			電波発射の条件
	低隣接周波数（試験周波数－300kHz）	試験周波数	高隣接周波数（試験周波数＋300kHz）	
0	－－－	－－－	－－－	発射される
1	45dBμＶ	－－－	－－－	発射されない
2	－－－	45dBμＶ	－－－	発射されない
3	－－－	－－－	45dBμＶ	発射されない

※　－－－：多チャネル信号発生器の停止又は 44dBμＶ 以下。

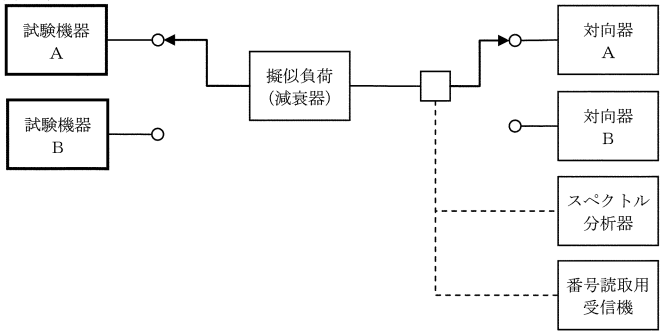
５　試験結果の記載方法

４⑹の試験では、試験機器から電波が発射されないことを確認した場合は「良」と、それ以外の場合は「否」と記載する。

４⑺の試験では、「０」のときに試験機器から電波が発射されることを、及び「１」から「３」までのときに電波が発射されないことを確認した場合は「良」と、それ以外の場合は「否」と記載する。

十三　混信防止機能

１　測定系統図



２　測定器の条件

⑴　番号読取用受信機は、試験機器及び対向器の移動局呼出符号又はシステム呼出符号を読み取ることができるものとする。

⑵　試験機器Ａと対向器Ａは通話が可能なように登録されており、試験機器Ｂと対向器Ｂは通話が可能なように登録されているものとする。

３　試験機器の状態

変調状態は、通常の使用状態とする。

４　測定操作手順

⑴　試験機器Ａから対向器Ａに発信を行う。

⑵　番号読取用受信機で試験機器Ａの移動局呼出符号又は基地局呼出符号を確認する。

⑶　チャネルが自動的に選択されて、通話状態となることを確認する。

⑷　試験機器Ｂと対向器Ｂで⑴から⑶までの操作を行う。

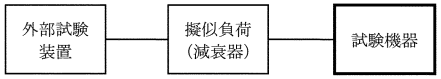
⑸　試験機器Ａから対向器Ｂへは発信できないことを確認する。

５　試験結果の記載方法

試験機器Ａと対向器Ａでは通話状態となることを確認し、かつ、試験機器Ａから対向器Ｂへは発信できないことを確認した場合は「良」と、それ以外の場合は「否」と記載する。

十四　識別装置

１　測定系統図



２　測定器の条件

⑴　試験機器に接続されている減衰器の減衰量を 30dB とする。

⑵　外部試験装置は、試験機器と回線接続ができ、かつ、定められた呼出符号が送信できるものとする。

３　試験機器の状態

変調状態は、通常の使用状態とする。

４　測定操作手順

⑴　外部試験装置と回線接続を行う。

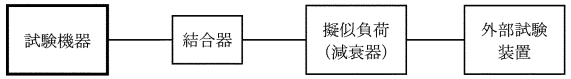
⑵　試験機器の送信信号から外部試験装置により、移動局呼出符号を読み取る。

５　試験結果の記載方法

試験機器の送信信号から外部試験装置により、移動局呼出符号を読み取ることができた場合は「良」と、それ以外の場合は「否」と記載する。

十五　総合動作試験

１　測定系統図



２　測定器の条件

外部試験装置は、擬似の基地局制御装置である。

３　試験機器の状態

試験用ＩＤ－ＲＯＭを装着する（ＩＤ書き込み装置により加入者データを内部のＲＯＭに書き込む。）。

４　測定操作手順

外部試験装置により呼出しを行い、試験機器が外部試験装置から指定されたチャネルに移行することを確認する。

５　試験結果の記載方法

外部試験装置により呼出しを行い、試験機器が外部試験装置から指定されたチャネルに移行することを確認した場合は「良」と、それ以外の場合は「否」と記載する。

十六　子機間通話機能

１　測定系統図